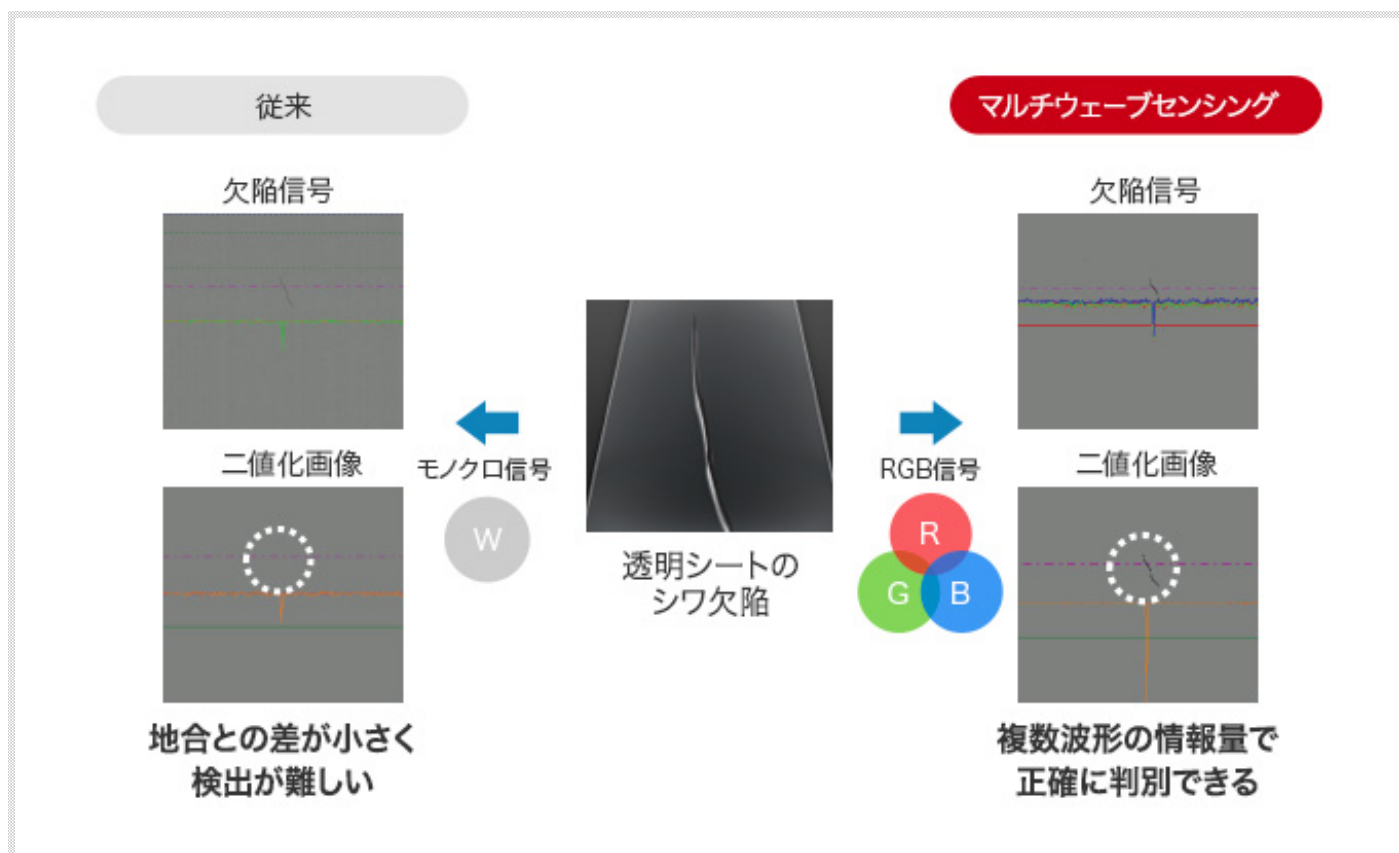


# シワ欠陥の検出



## 微細なシワ欠陥も情報量の多さで高精度に検出

透明フィルムの製造工程において、搬送中にフィルムがよれて発生したシワ欠陥は、検出困難な欠陥のひとつです。従来のモノクロ検査では、透明フィルムのシワ欠陥は、地合と欠陥との差が小さいため検出が困難でした。マルチウェーブセンシングなら、光学系の工夫に加え、複数波形を活用した豊富な情報量によって、微細なシワ欠陥を正確に検出します。



お気軽にご相談ください。

オムロン シート検査装置/フィルム検査装置、  
多波長検査に関するご相談・ご質問はこちらから

オムロン株式会社 検査システム事業部 営業部

03-6718-3551

受付時間 9:00~17:30 (土日祝は休)

